E 37 04 547 A 1

19 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND

OffenlegungsschriftDE 3704547 A1

(5) nt Ct.4. H 05 K 3/18

> H 05 K 3 24 H 01 L 21/60 // C23C 14/34



DEUTSCHES PATENTAMT (1) Aktenzeichen: P 37 04 547.4 (2) Anmeldetag: 13. 2.87

) Offenlegungstag: 25. 8.88

(71) Anmelder:

BBC Brown Boveri AG, 6800 Mannheim, DE

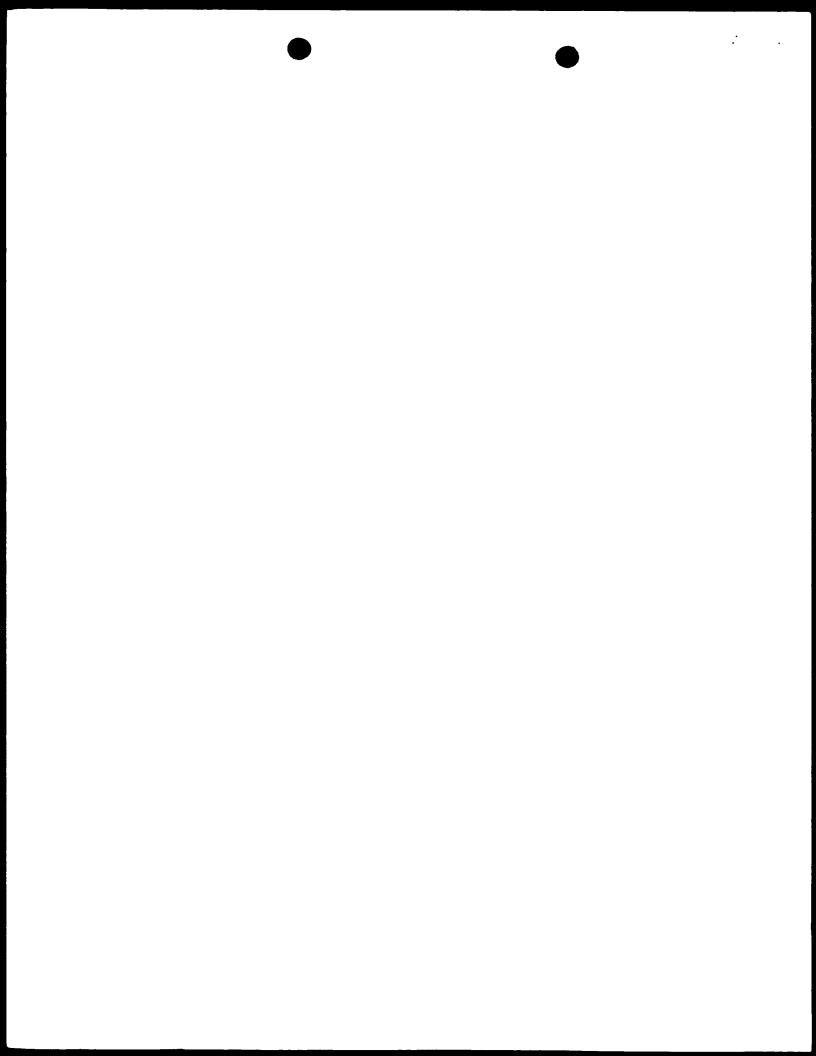
Erfinder:

Krokoszinski, Hans-Joachim, Dipl.-Phys. Dr., 6907 Nußloch, DE; Oetzmann, Henning, Dipl.-Phys. Dr., 6901 Mauer, DE; Gilbers, Dieter, Dipl.-Ing., 6840 Lampertheim, DE

(3) Verfahren zur Herstellung von Lötpads und Bondpads auf Dünnschichthybridschaltungen

Bei diesem Verfahren werden in einem Herstellungsprozeß simultan sowohl die für die Lötung von oberflächenmontierten Bauteilen optimalen Cu/Sn-Lötpads als auch die für Al-Drahtbonden optimalen Ni/Au-Bondpads produziert. Hierzu werden die zum Löten vorgesehenen Kupferschichten (5) zusätzlich mit einer auf SiO₂ basierenden Glasschicht (6) bedampft. Anschließend wird die gesamte Schaltung mit einer Al₂O₃-Schicht (7) bedampft, mit einem fotosensitiven Polyimidlack oder einem Photolack (8) beschichtet, über den Lötpads (13) und den Bondpads (12) belichtet und entwikkelt. Nach Ätzung der Al₂O₃-Schicht (7) in den Padfenstern kann die freigelegte Kupferschicht (5) der Bondpads (12) nach einer Aktivierung durch eine Pd-Aktivatorlösung chemisch vernickelt und vergoldet werden. Nach Ätzung der Glasschicht (6) von den Lötpads (13) wird die freigelegte Kupferschicht (5) der Lötpads (13) chemisch vernickelt.





eingangs genannten Art anzugeben, mit dem simultan sowohl die für die Lötung von oberflächenmontierten Bauteilen optimalen Cu/Sn-Lötpads als auch die für Al-Drahtboncen optimalen Ni/Au-Bondpads produzierbar

Diese Aufgabe wird alternativ durch die im Anspruch 1 und 2 gekennzeichneten Merkmale gelöst.

Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile bestehen insbesondere darin, daß für die beiden Montagearten Löten und Bonden die jeweils geeignete Padschichtfolge auf ein und demselben Substrat in einem Herstellprozeß realisiert wird, d. h. sowohl die gut bondbaren (jedoch schlecht lötbaren) Ni/Au-Flächen als auch die gut lötbaren (jedoch schlecht bondbaren) Cu/Sn-Flächen.

Man kann durch den vorgeschlagenen Prozeß das 15 Aufdampfen von Nickel vermeiden, da dieses Material am stärksten zum "Abflittern" von den Masken neigt; darüber hinaus spart man dadurch einen zusätzlichen Platz in einer 4-Tiegel-Elektronenstrahlkanone (zumal diese für Al, Cu, Aufdampfgas und Al₂O₃ schon verge- 20 ben sind). Der zusätzliche Aufwand für diesen simultanen Prozeß ist klein. Es wird keine zusätzliche Maske für die Glasabdeckung der Pads benötigt, da man diese Struktur zusammen mit den ohnehin benötigten Glasschichten (Isolationsschichten von Kreuzungen und 25 Kondensatoren) aufdampfen kann. Es ist lediglich ein zusätzlicher Atzschritt zum Entfernen der Glasabdekkung auf den Lötpads notwendig. Als chemische Verstärkungsbäder werden Ni + Au + Sn eingesetzt.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in 30

den Unteransprüchen gekennzeichnet.

Die Erfindung wird nachstehend anhand des in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiels erläu-

Fig. 1 bis 5 die einzelnen Schritte des Verfahrens zur 35 simultanen Herstellung von Lötpads und Bondpads auf Dünnschichthybridschaltungen.

In den Fig. 1 bis 5 sind die einzelnen Schritte des Verfahrens zur simultanen Herstellung von Lötpads und Bondpads auf Dünnschichthybridschaltungen dar- 40 gestellt. Aus der Fig. 1 ist zu erkennen, daß auf ein Substrat 1 (Keramik- oder Glassubstrat) ganzflächig eine Grundoxidschicht 2 aufgebracht ist. Dies erfolgt mittels Sputtern oder Aufdampfen (bekannt z. B. aus Hanke/ Fabian, Technologie elektronischer Baugruppen, VEB- 45 Verlag Technik, Berlin. 3. Auflage 1975/1982, Seite 76 bis 81). Als Material für die Grundoxidschicht 2 dient beispielsweise Al₂O₃.

In additiver Dünnschichttechnik wird anschließend eine Aluminiumschicht 3 als Leiterbahnnetzwerk durch 50 Masken aufgedampft. Dieses Leiterbahnnetzwerk mit einer Schichtdicke von ca. 1 µm weist eine geringe Stromtragfähigkeit auf und dient z.B. zur Verbindung von in additiver Dünnschichttechnik hergestellten Kondensatoren und oxidpassivierten Widerständen, wobei 55 tungsstruktur mit den fertiggestellten Bondpads 12 und auch Leiterbahnkreuzungen realisierbar sind.

Danach erfolgt in einem weiteren Verfahrensschritt das Aufdampfen einer dünnen Haftschicht 4 (Cr oder NiCr, typisch 0,02 μm) sowie einer Cu-Schicht (typisch 0.5 µm) durch Masken auf alle Flächen, die zum Löten 50 und Bonden sowie zur Bildung eines Leiterbahnnetzwerkes aus Cu mit hoher Stromtragfähigkeit vorgesehen sind. Die Haftschicht 4/Kupferschicht 5 ist dabei durch teilweise Überlappung an die Aluminiumschicht 3 angeschlossen.

Hieran schließt sich ein weiterer Aufdampfprozeß über Masken an, bei dem lediglich die zum Löten vorgesehenen Flächen zusatzlich mit einer auf SiO2 basieren-

den Glasschicht 6 bedampft werden (Aufdampfglasschicht). Die gesamte Schaltung einschließlich aller Lötund Bondflächen wird aarauf im selben Vakuum mit einer Al₂O₃-Schicht 7 (Oxidschicht) bedampft und somit gegen Oxidation und Korrosion geschützt (Passivierung)

Nachfolgend wird die Schaltung an Luft bei beliebiger Temperatur bis maximal 500°C getempert. Wegen der aufgebrachten Al₂O₃-Schicht 7 konnen das darunterliegende Leiterbahnnetzwerk sowie die Lötpads und Bondpads bei hohen Temperaturen getempert werden, um die Haftung zu verbessern, ohne Oxiadation oder Korrision der Kupferschicht 5 zu riskieren. Im Anschluß daran wird eine Photolackschicht 8 auf die Schaltung aufgebracht, (Lackpassiv:erung). Die Photolackschicht 8 wird mittels Photomaske simultan über den Bondpads und Lötpads belichtet und mittels einer darauffolgenden Entwicklung photolithographisch freigelegt. Es werden also in der Photolackscnicht 8 an denjenigen Stellen Offnungen erzeugt, an denen die darunterliegende Al₂O₃-Schicht 7 in einem späteren Verfahrensschritt entfernt werden soll.

Nach der Entwicklung ergibt sich die in Fig. 2 gezeigte Schaltungsstruktur, bei der die Photolackschicht 8 mit Offnungen zur Bildung von Bond- und Lötpads versehen ist.

Darauf wird die Photolackschicht 8 bei Temperaturen um 220°C gehärtet. Anschließend werden die Kupferschicht 5 am Ort der Bondpads und die Glasschicht 6 am Ort der Lötpads 9 durch Ätzung der Al₂O₃-Schicht 7 freigelegt (Oxidatzung), so daß sich die in Fig. 3 dargestellte Schaltungsstruktur ergibt. Die anorganische Schutzschicht, d. h. die Al₂O₃-Schicht 7 mit darüberliegender gehärteter Photolackschicht 8 dient als Passivierdoppelschicht, wobei die Kontaktflächen jeweils freigelegt sind. Durch die Passivierschichtfolge ist ein Schutz der Schaltung vor Oxidation, Korrosion, Wasserdampfdiffusion, mechanischer Beschädigung und chemischen Bädern gewährleistet.

Danach wird die freigelegte Kupferschicht 5 der Bondpads nach einer Aktivierung durch eine Pd-Aktivatorlösung chemisch vernickelt (Stärke der Ni-Schicht 9 mindestens 1,0 µm) und abschließend chemisch vergoldet (Stärke der Au-Schicht 10 mindestens 0,1 µm), wie in Fig. 4 dargestellt, ohne daß die Lötpads unter der Glasschicht 6 davon betroffen sind.

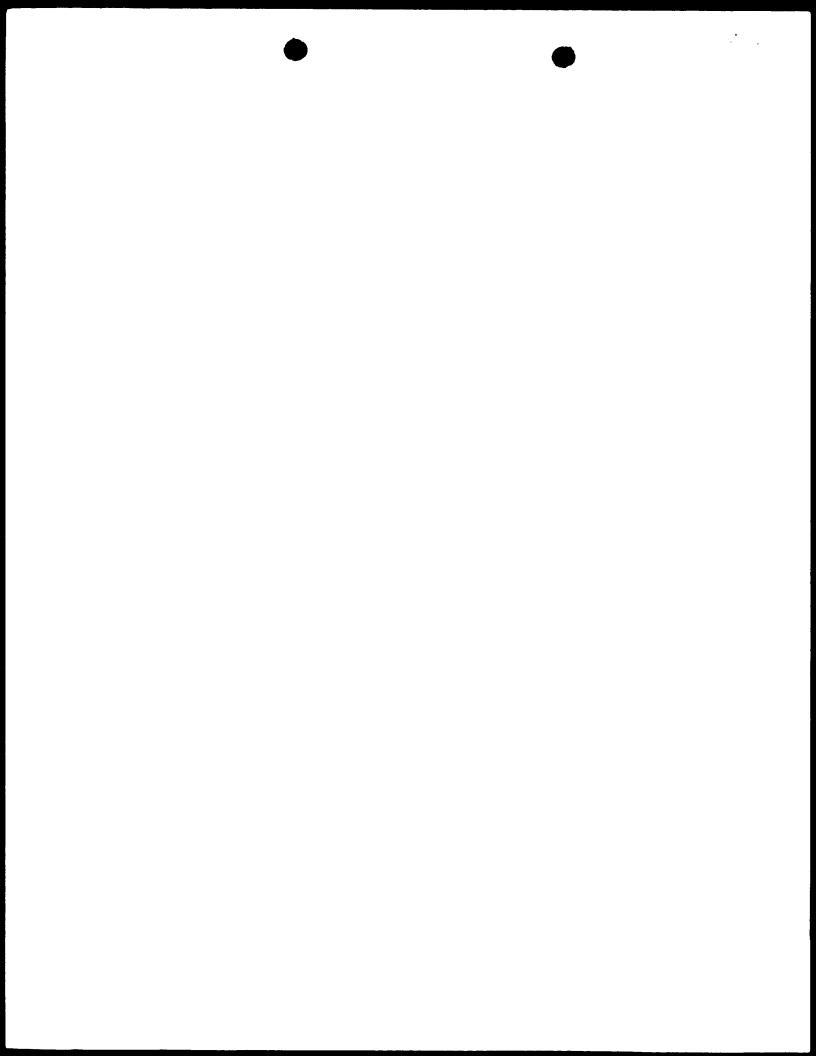
Im Anschluß an die Vergoldung wird die Glasschicht 6 von den Lötpads abgeätzt, ohne daß die Bondpads angegriffen werden, da diese durch die Goldschicht 10 geschützt sind. Nachfolgend wird die freigelegte Kupferschicht 5 am Ort der Lötpads chemisch verzinnt (Stärke der Zinnschicht 11 ungefähr 0,01 µm), ohne daß die Bondpads wegen ihrer Goldabdeckungen davon betroffen sind. Es ergibt sich die in Fig. 5 gezeigte Schal-Lotpads 13.

Bei einer Variante des beschriebenen Verfahrens zur Herstellung Lötpads und Bondpads wird eine fotosensitive Polyimidlackschicht anstelle einer Photolackschicht 8 verwendet. Bei dieser Variante wird die fotosensitive Polyimidlackschicht direkt nach dem Aufdampfen der Al₂O₂-Schicht 7 aufgebracht. Nach Beilichtung und Entwicklung der Polyimidiackschicht folgt der Temperprozeß bei Temperaturen bis maximal 500°C, d.h. gleichzeitig mit der Temperung der Kupferschicht 5 wird auch die Polyimidlackschicht gehärtet. Es entfällt demnach vorteilhaft der bei Verwendung einer Photolackschicht notwendige eigene Härtungsprozeß bei 220°C. Die sich



- Leerseite -

4 4 5



mmert Int. CL^A.

Anme detag: Offenisgungstag 37 04 547 H 05 K 3/18 13. Februar 1987

13. Februar 1987 25. August 1988

